

## ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ДИЭЛЕКТРИК-МЕТАЛЛ И СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ ВТСП-ОКСИДОВ

© Н.В.Аншукова, А.И.Головашкин, Л.И.Иванова,  
О.Т.Малючков, А.П.Русаков

Физический институт им.П.Н.Лебедева Российской академии наук,  
117924 Москва, Россия

(Поступила в Редакцию 22 ноября 1995 г.

В окончательной редакции 8 апреля 1996 г.)

Проведен анализ экспериментальных данных по тепловому расширению, температурной зависимости теплоемкости в магнитных полях, верхнему критическому магнитному полю  $H_{c2}(T)$  и другим свойствам оксидных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Предложен физический механизм электронного упорядочения, концентрационного перехода диэлектрик-металл и сверхпроводимости ВТСП. Объяснены аномальные свойства ВТСП.

Обилие уже имеющихся разнообразных, в том числе взаимоисключающих, теоретических работ о механизме сверхпроводимости в ВТСП (см., например, [1-6]) показывает, что на сегодняшний день не существует даже надежно установленной физической картины как сверхпроводящего, так и нормального состояния ВТСП. В силу очевидной сложности проблемы на данной стадии актуальна разработка именно физической картины, основанной на анализе современных твердо установленных экспериментальных фактов: температурных зависимостей теплоемкости, критических магнитных полей, теплового расширения и других термодинамических свойств.

Ниже предлагается электронная структура оксидных ВТСП, развития на основе экспериментальных данных. Дано объяснение аномальных экспериментальных свойств ВТСП. Некоторые предварительные результаты работы были опубликованы ранее [7,8].

### 1. Электронная структура и природа высокотемпературной сверхпроводимости

Высокотемпературная сверхпроводимость в оксидных материалах связана с их особой электронной структурой и спецификой электронного упорядочения в них. Легче это продемонстрировать на относительно простой модельной псевдокубической системе  $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$  (ВКБО), а затем учесть специфику других ВТСП-оксидов.

Расчеты электронных спектров показывают, что соединение  $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$  при  $x \rightarrow 0$  должно быть металлом, в котором зона проводимости заполнена наполовину. Однако из эксперимента следует, что

$\text{BaBiO}_3$  и  $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$  при  $x \leq 0.1$  являются диэлектриками с энергетической щелью  $E_g \approx 2 \text{ eV}$  [9,10]. Диэлектрическая щель для образцов с  $0.1 \leq x < 0.3$  оказывается того же порядка, что и для  $x = 0$  [10,11]. Из прямых электронно-микроскопических наблюдений атомной структуры ВКБО для  $x > 0.1$  [12] следует, что октаэдрические ячейки имеют примерно одинаковые размеры, т.е. наличие этой щели нельзя объяснить моделью «дышащей моды». Следовательно, ионы Bi не могут иметь сильно отличающуюся валентность ( $2\text{Bi}^{+4} \rightarrow \text{Bi}^{+3} + \text{Bi}^{+5}$ ), что лежит в основе этой модели, которая использует факт большой разницы размеров ионов  $\text{Bi}^{+3}$  и  $\text{Bi}^{+5}$ . Более того, измерения рассеяния мюонов ( $\mu\text{SR}$ ) показывают, что ионы Bi не обладают заметным локальным магнитным моментом [13,14], т.е. ионы Bi не могут быть четырехвалентными и их нельзя описать и по схеме  $2\text{Bi}^{+4}\text{Bi}^{+4+\beta} + \text{Bi}^{+4-\beta}$  (где  $0 \leq \beta < 1$ ), как это делается в «магнитных» моделях.

Непротиворечиво эти экспериментальные данные можно объяснить в предлагаемой нами модели «упорядочения дырочных связей». Верхняя валентная зона ВКБО при малых  $x$  ( $x < 0.3$ ) образована в основном кислородными  $\text{O}(2p)$ -состояниями [15,16]. Примесь состояний  $\text{Bi}(6s)$  к состояниям  $\text{O}(2p)$  у потолка валентной зоны составляет  $\delta = 0.03-0.05$ . Совокупность экспериментальных данных указывает на то, что нелегированное соединение  $\text{BaBiO}_3$  или соединение  $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$  при малых  $x$ , где калий замещает ионы бария, описываются частично ковалентными формулами  $\text{Ba}^{+2}\text{Bi}^{+3+\delta}\text{O}_2^{-2}\text{O}^{-(1+\delta)}$  или  $\text{Ba}_{1-x}^{+2}\text{K}_x^{+1}\text{Bi}^{+3+\delta}\text{O}_2^{-2}\text{O}^{-(1+\delta)} + h_x$  (где  $h_x$  — концентрация свободных носителей заряда (дырок), как при легировании в полупроводниках). Величина  $\delta \approx 0.03-0.05$  в соответствии с экспериментами [15,16]. Учитывая малость  $\delta$  для ВКБО, вышеуказанные формулы можно переписать как  $\text{Ba}^{+2}\text{Bi}^{+3}\text{O}_2^{-2}\text{O}^{-1}$  или  $\text{Ba}_{1-x}^{+2}\text{K}_x^{+1}\text{Bi}^{+3}\text{O}_2^{-2}\text{O}^{-1} + h_x$ . Значит, вблизи одного из эпитаксиальных ионов кислородного октаэдра находится локализованная дырка. Точнее, эта дырка расположена на связи  $\text{Bi}-\text{O}$ , как это показано на рис. 1,а. Ее точная локализация, т.е. небольшое смещение к иону Bi, зависит от примеси состояний  $\text{Bi}(6s)$  к состояниям  $\text{O}(2p)$  у потолка валентной зоны, т.е. от величины  $\delta$ .

Таким образом, для каждого кислородного октаэдра с ионом  $\text{Bi}^{+3}$  внутри него имеется только одна частично ковалентная связь с локализованной на ней тяжелой дыркой. Эти дырочные связи могут упорядочиваться в кристалле в одном из направлений (направление  $c$ ) как  $\text{Bi}^{+3}\text{O}^{-1}\text{Bi}^{+3}\text{O}^{-1}$  и т.д., как показано на рис. 1,а. Если эти дырочные связи упорядочены навстречу друг другу, тогда в направлении  $c$  возникает последовательность  $\text{Bi}^{+3}\text{O}^0\text{Bi}^{+3}\text{O}^{-2}\text{Bi}^{+3}\text{O}^0$  и т.д., как показано на рис. 1,б. При этом происходит удвоение периода решетки вдоль оси  $c$ . Упорядоченное расположение тяжелых дырок, как показано в [17], соответствует кристаллизации Вигнера и приводит к уменьшению потенциальной (электростатической) энергии. Упорядочение в противофазе дает дополнительный выигрыш в кинетической энергии за счет образования энергетической щели при удвоении периода решетки. Соответствующее удвоение периода решетки для двух других кристаллографических направлений  $a$  и  $b$  показано на рис. 1,с. Таким образом, упорядочение в противофазе частично ковалентных связей в направлении

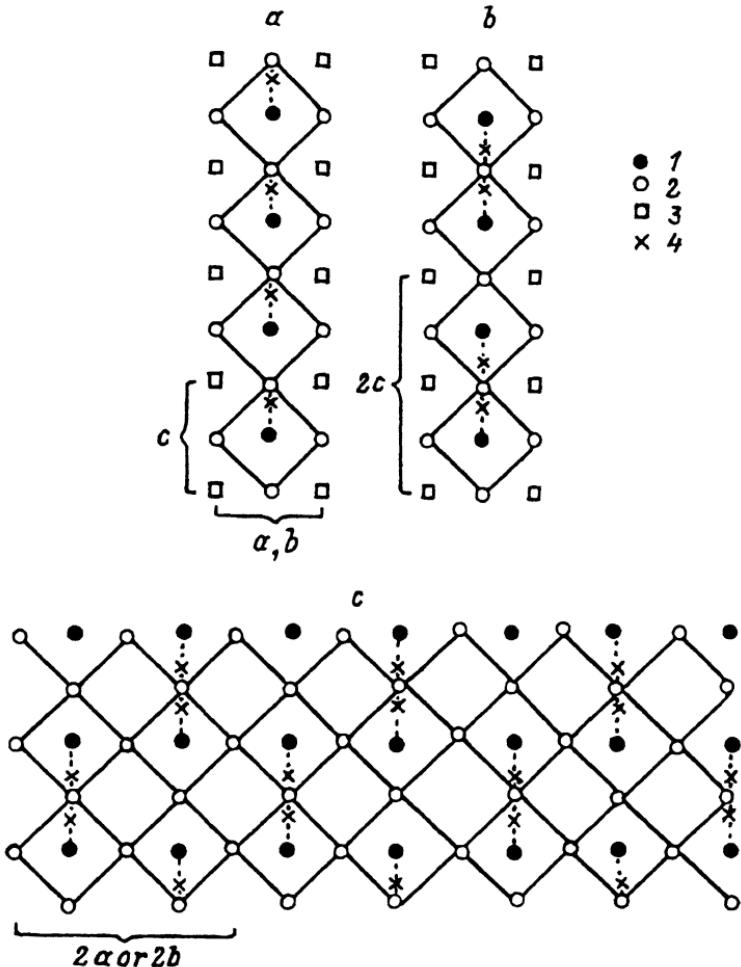


Рис. 1. Электронная структура  $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$  для малых  $x$  ( $x < 0.3$ ).

1 — ион  $\text{Bi}^{+3}$ , 2 —  $\text{O}^{-2}$ , 3 — ион  $\text{Ba}^{+2}$  или  $\text{K}^{+1}$ , 4 — локализованная дырка на связи  $\text{Bi}-\text{O}$ . *a* — упорядочение локализованных дырок в фазе вдоль одной из осей (*c*) кристаллической решетки, *b* — упорядочение локализованных дырок в противофазе вдоль оси *c* с результирующим удвоением периода в этом направлении, *c* — удвоение периода решетки в кристаллографических направлениях *a* и *b* из-за упорядочения локализованных дырок в противофазе.

влениях *a*, *b* и *c* приводит к удвоению периода решетки с результирующим образованием диэлектрической щели  $E_g$  на поверхности Ферми, т.е. к появлению волны зарядовой плотности (ВЗП) с экстремумами на эпикальных атомах кислорода. С этой ВЗП связан периодический кулоновский потенциал, который и приводит к диэлектризации электронного спектра на поверхности Ферми. При этом введение модели «дышащей моды» или «магнитной» модели не требуется. Для простоты на рис. 1 пренебрегается эффектом небольшого искажения решетки [12] типа «tilting», возникающего из-за наличия двух слегка различающихся расстояний  $\text{Bi}^{+3}-\text{O}^0$  и  $\text{Bi}^{+3}-\text{O}^{-2}$ .

Рассмотренную для ВКБО схему локализации и упорядочения тяжелых дырок можно распространить с некоторыми дополнениями и на

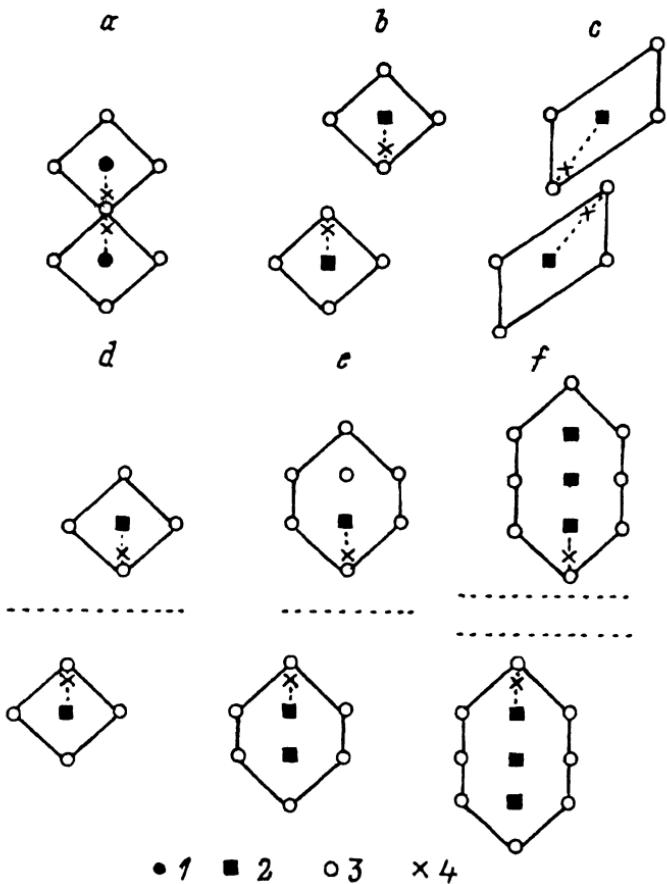


Рис. 2. Локализация тяжелых дырок и их упорядочение в противофазе в диэлектрическом состоянии купратных и висмутовых оксидных ВТСП.

1 — ион Bi, 2 — ион Cu, 3 — ион кислорода, 4 — локализованная тяжелая дырка на эпикальных связях Cu—O и Bi—O, пунктир — слои TiO, BiO или цепочки CuO (для ясности все другие ионы не показаны). а —  $Ba_{1-x}K_xBiO_3$ , б —  $La_{2-x}Sr_xCuO_4$ , с —  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_4$ , д —  $TlBa_2CuO_5$ , е —  $TlBa_2CaCu_2O_7$  или  $YBa_2Cu_3O_7$ , ф —  $Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$ .

другие оксидные ВТСП. На рис. 2 показана схема упорядочения дырок для основных типов ВТСП. Из рис. 2,а, относящегося к BKBO, видно, что кислородные октаэдры соединены между собой через общий атом кислорода. В купратных ВТСП кислородные октаэдры (или в общем случае кислородные полигонэдры) окружают ионы меди и разделены между собой вдоль оси *c* (рис. 2,б–*f*). Например, в случае  $La_{2-x}Sr_xCuO_4$  (LSCO), как видно из рис. 2,б, эти октаэдры разделены, так как эпикальные ионы кислорода находятся в разных (соседних) слоях  $La(Sr)O$ . Так же как и в BKBO, в LSCO на каждый кислородный октаэдр приходится одна частично ковалентная связь (локализованная дырка). Упорядочение таких дырочных связей Cu—O в в противофазе для соседних октаэдров, так же как в BKBO, приводит к появлению ВЗП, т.е. к разной валентности эпикальных ионов кислорода вдоль оси *c*. Вдоль осей *a* и *b* наблюдается такой же сдвиг по фазе в расположении этих связей, как и для BKBO (рис. 1,с). Наличие такой ВЗП в LSCO также

приводит к появлению диэлектрической щели на поверхности Ферми при малых  $x$ . Из того факта, что в LSCO кислородные октаэдры вдоль оси с разделены, следует появление иона кислорода с зарядом  $O^{-1}$  при локализации дырки на эпикальном кислороде, а не  $O^0$ , как в ВКБО.

Отметим, что в купратных ВТСП дырка, так же как и в ВКБО, локализована на эпикальной связи, а не строго на эпикальном ионе кислорода. Но если в ВКБО примесь висмутовых состояний к кислородным  $\delta$  у потолка валентной зоны составляет всего несколько процентов [15,16,18], то в LSCO при малых  $x$  или в других купратных ВТСП-оксидах примесь медных состояний  $\delta$  превышает 30% [18,19]. Это означает заметный сдвиг дырки к иону меди. В результате упрощено можно записать химическую формулу соединений  $La_2CuO_4$  и LSCO при малых  $x$  как  $La_2^{+3}Cu^{+(1+\delta)}O_3^{-2}O^{-(1+\delta)}$  или  $La_{2-x}^{+3}Sr_x^{+2}Cu^{+(1+\delta)}O_3^{-2}O^{-(1+\delta)} + h_x$ , где  $\delta \approx 0.4$ . Появление у иона меди валентности  $1 + \delta$  приводит к антиферромагнетизму этих соединений с локальным магнитным моментом, приходящимся на ион меди, равным примерно 0.4 магнетона Бора [20]. В результате наличие двух эпикальных ионов кислорода вместо одного общего, как в ВКБО, приводит дополнительно с ВЗП к появлению волн спиновой плотности (ВСП). Кристаллическая структура ВКБО и LSCO различна, следствием чего является и различие ряда их физических свойств. Но общим для этих двух типов соединений является локализация и противофазное упорядочение тяжелых дырок (рис. 2,*a, b*), приводящее к ВЗП и дистекстризации электронного спектра с  $E_g \approx 2$  eV.

Кислородный октаэдр вокруг иона Cu может быть искажен, как в случае  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_4$  из-за большого размера иона Nd (рис. 2,*c*). Кроме того, для этого соединения нужно учесть, что трехвалентный атом неодима замещается четырехвалентным атомом церия. Это эквивалентно введению донорной примеси. В этом случае химическую формулу для малых  $x$  можно записать как  $Nd_{2-x}^{+3}Ce_x^{+4}Cu^{+(1+\delta)}O_3^{-2}O^{-(1+\delta)} + e_x$ , где  $e_x$  — концентрация свободных электронов.

Между кислородными октаэдрами могут быть расположены дополнительные атомные слои типа TiO в соединении  $TiBa_2CuO_5$  или BiO в соединении  $BiSr_2CuO_5$  (рис. 2,*d*). Механизм упорядочения дырочных связей и возникновения ВЗП остается при этом таким же, как в  $La_2CuO_4$  (рис. 2,*b*). Кислородный октаэдр может быть заменен кислородным полигидром, содержащим не один, а два иона меди (рис. 2,*e*), что соответствует случаям  $TiBa_2CaCu_2O_7$ ,  $BiSr_2CaCu_2O_7$  или  $CuBa_2YC_{2O_{6+x}}$ . Во всех этих случаях кислородный полигидр содержит только одну дырочную связь. Механизм упорядочения этих дырочных связей, возникновения ВЗП и ВСП остается при этом таким же, как и ранее.

В случае когда внутри кислородного полигидра находятся  $n$  слоев  $CuO_2$  (как, например, в  $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$ ), кислородный полигидр вытягивается (рис. 2,*f* для случая  $n = 3$ ), но содержит по-прежнему только одну дырочную (ковалентную) связь с эпикальным ионом кислорода. При этом между эпикальными ионами кислорода может находиться не один, а несколько атомных слоев (например, два слоя BiO в соединении  $Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_{10}$  на рис. 2,*f*). Обобщение на другие оксидные ВТСП очевидно.

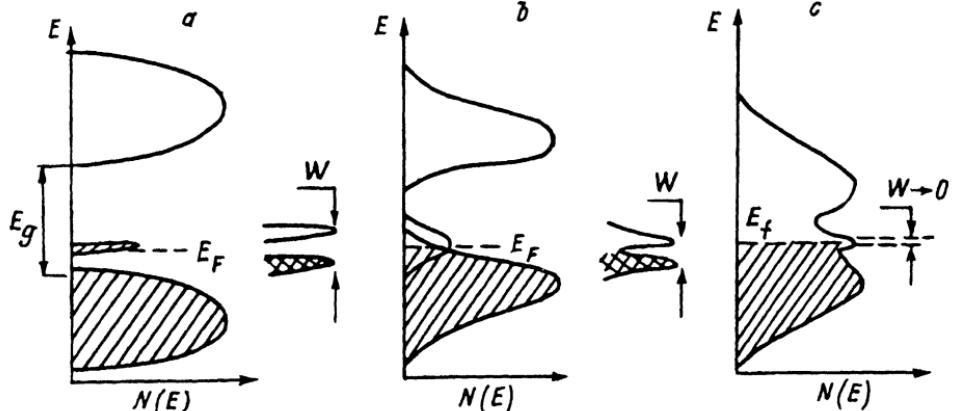


Рис. 3. Схематическое представление энергетического спектра ВТСП при разных уровнях легирования. а — малый уровень легирования (диэлектрическая фаза), б — средний уровень легирования (система вблизи перехода Д-М), с — большой уровень легирования (металлическая фаза).

Таким образом, видно, что во всех оксидных ВТСП проявляется общий механизм образования и упорядочения ковалентных (дырочных) связей, приводящий к возникновению ВЗП и диэлектрической щели. Если соседние кислородные октаэдры или полиэдры имеют общий эпикальный кислород вдоль оси с (рис. 2, а), то возникает антисегнетоэлектрическое упорядочение, как в ВКВО. Если эпикальные ионы кислорода двух соседних октаэдров или полиэдров пространственно разделены вдоль оси с (рис. 2, б-г), то дополнительно с ВЗП возникает антиферромагнитное упорядочение. Наличие антиферромагнитного упорядочения в оксидных купратных ВТСП при малом уровне легирования является хорошо установленным фактом. Сверхструктурное упорядочение или возникновение ВЗП в этих материалах при разных уровнях легирования экспериментально наблюдалось, например, в [21, 22]. В принципе кислород частично или полностью может быть заменен другими халькогенами.

Упорядочение локализованных тяжелых дырок помимо изменения симметрии кристаллической структуры ВТСП приводит и к перестройке как фононного, так и электронного энергетического спектра этих соединений. На рис. 3 схематически показан электронный энергетический спектр ВТСП, а также его изменение при легировании. При малых уровнях легирования (в диэлектрической фазе) в плотности электронных состояний  $N(E)$  наблюдается энергетическая щель  $E_g$  (порядка 1–2 eV). Вблизи уровня Ферми  $E_F$  в запрещенной зоне при легировании возникают примесные уровни (рис. 3, а). Они обусловливают полупроводниковую проводимость. При дальнейшем легировании примесные уровни превращаются в примесную зону, которая перекрывает либо с потолком валентной зоны (проводимость  $p$ -типа) (рис. 3, б), либо с дном зоны проводимости (проводимость  $n$ -типа). При некотором уровне легирования возникает металлическая проводимость. При еще более высоком уровне легирования зоны перекрываются, и образуется обычное металлическое состояние (рис. 3, с).

Таким образом, видно, что в ВТСП происходит концентрационный фазовый переход диэлектрик–металл (Д-М). Например, в

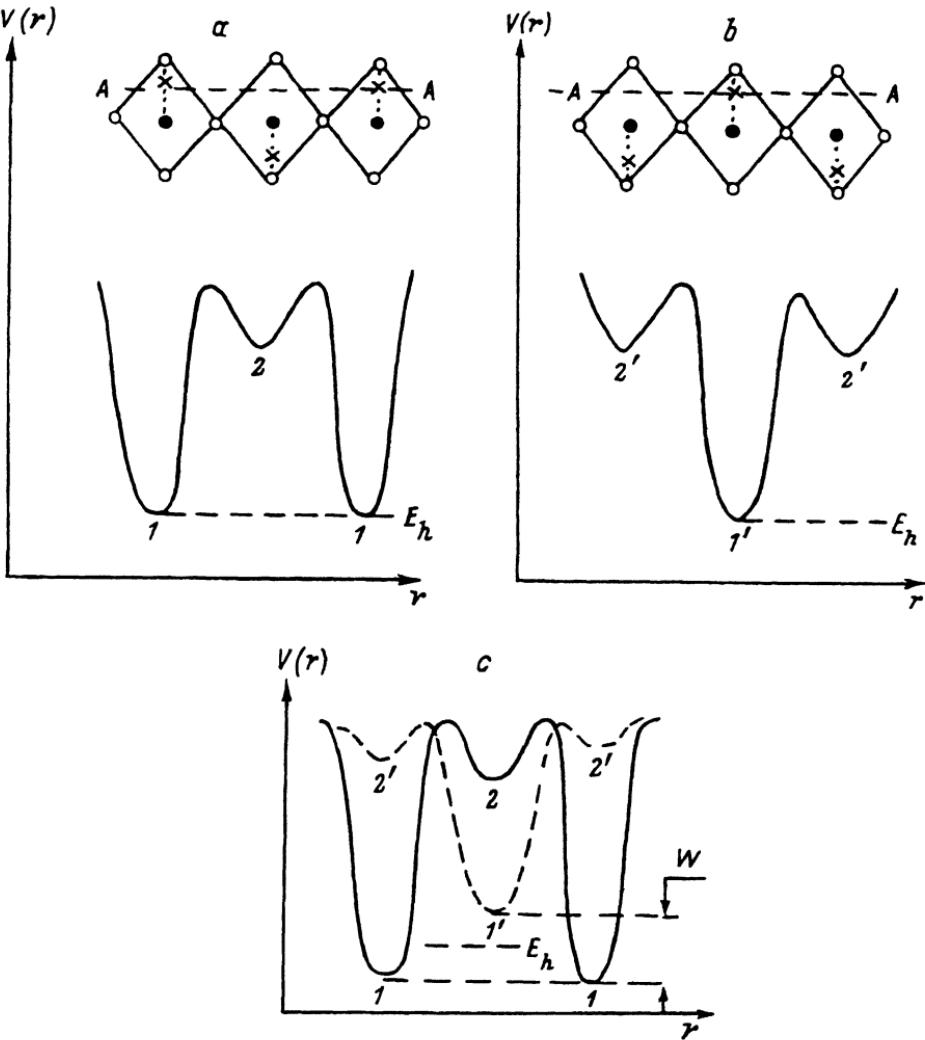


Рис. 4. ВЗП и потенциальные функции  $V(r)$  в BKBO или LSCO.

*a, b* — два возможных варианта упорядочения локализованных дырок вдоль кристаллографической оси *a* (сечение *AA'*) и соответствующие этим упорядочениям пространственные зависимости периодического потенциала  $V(r)$ , *c* — потенциальные функции  $V(r)$  при учете снятия вырождения двух ВЗП. Величина  $W$  соответствует энергетической разнице между основным (1) и возбужденным (1') состояниями локализованной дырки,  $E_h$  — энергия основного состояния локализованной дырки без учета вырождения.

$\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$  это происходит при легировании калием при  $x \approx 0.3$ . В  $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$  такой переход наблюдается при  $x \sim 0.1$ . Необходимо отметить, что металлическую фазу ВТСП можно вновь перевести в новое диэлектрическое состояние, точнее, в компенсированный полупроводник. В BKBO и LSCO этого можно добиться удалением кислорода. Ваканции кислорода проявляют себя как доноры, компенсирующие акцепторную примесь (калий или стронций).

Выше было показано, что в ВТСП существуют ВЗП, возникающие из-за упорядочения локализованных дырок на эпикальных (дырочных) связях. Для каждого симметричного кристаллографического направления

вления существует двухкратное вырождение ВЗП, которое соответствует двум разным способам распределения локализованных зарядов на двух соседних эпикальных связях. На рис. 4 показаны два способа упорядочения локализованных дырок, например, вдоль направления  $a$  в BKBO или LSCO и соответствующие им потенциальные функции  $V(r)$ , где  $r$  — расстояние в направлении  $a$ . Разница потенциальных энергий в точках 1 и 2 (рис. 4, a) или в точках 1' и 2' (рис. 4, b) для сечения AA обуславливает энергетическую щель  $E_g$ , показанную на рис. 3, a. Потенциалы в точках 1 и 1' (рис. 4, a, b) в силу эквивалентности обеих ВЗП равны, основные состояния локализованных дырок считаются приблизительно совпадающими с минимумами  $V(r)$  и обозначены как  $E_h$ . Кристаллическое поле снимает вырождение двух этих ВЗП. Потенциальные функции  $V(r)$  после снятия вырождения показаны на рис. 4, c. При снятии вырождения возникает небольшая по сравнению с  $E_g$  разность энергий (энергетическая щель)  $W$  между двумя минимумами потенциала в точках 1 и 1'. Величина щели  $W$  соответствует локальным перескокам тяжелых дырок между соседними эпикальными связями и определяется локальной деформацией и поляризацией решетки. Величина  $W$  порядка энергии фононов на границе зоны Бриллюэна. Возбуждениям через эту щель соответствуют переходы с нижнего на верхний потенциальный уровень (на рис. 4, c из точки 1 в точку 1'). Возникающая при снятии вырождения деформация решетки на рис. 4, c не показана.

Уровни энергии в потенциальных ямах в окрестностях точек 1 и 1' (рис. 4, c) уширяются до мини-зон из-за возможности туннелирования тяжелых дырок между различными ямами. Плотность состояний этих узких зон — основного (точка 1) и вырожденного (точка 1') — показана на рис. 3 в виде узких пиков с разностью энергий  $W$ .

Снятие вырождения между двумя ВЗП и появление энергетической щели  $W$  — это проявления неустойчивости решетки для определенных направлений в кристалле. Неустойчивость решетки связана с тем, что поправка к энергии системы во втором порядке теории возмущений для основного (неперестроенного) состояния будет отрицательной для процессов переброса тяжелых дырок с участием фононов  $\omega_{ph}(Q)$  с волновым вектором  $Q \approx G/2 = \pi/a$  на границе зоны Бриллюэна ( $G$  — вектор обратной решетки). Особая роль указанных коротковолновых фононов здесь обусловлена тем, что возбуждениям тяжелых дырок соответствуют перескоки на короткие расстояния между соседними эпикальными связями, т.е. на величину периода решетки  $a$ . Это соответствует возбуждению фононов с квазипульсом  $Q \approx \pi/a$ .

Отрицательная поправка к энергии приводит к отрицательной диэлектрической проницаемости  $\epsilon(\omega, q, q+G/2)$  для соответствующих частот  $\omega_{ph}(Q)$  и волновых векторов  $Q \approx G/2$ . Возбуждение таких фононов при нагревании кристалла с учетом отрицательности диэлектрической проницаемости  $\epsilon$  будет сопровождаться сжатием кристалла, т.е. отрицательным коэффициентом теплового расширения. Возбуждение других фононов, для которых  $\epsilon(\omega, q, q') > 1$ , приводит к расширению решетки. Наличие таких фононов стабилизирует решетку.

Предлагаемый подход позволяет понять отличие механизма сверхпроводимости ВТСП от обычного фанонного механизма сверхпроводимости. Наличие возбуждений через щель  $W$  соответствует коротковолновым бозонам. Взаимодействие свободных носителей за-

ряда, возникающих при легировании, с этими локальными бозонами должно приводить к спариванию этих носителей. Таким парам соответствует малая длина когерентности  $\xi$  из-за локальности бозонов. Возникает сверхпроводящее состояние с критической температурой  $T_c \sim (W/k) \exp(-1/\lambda)$ , где  $k$  — постоянная Больцмана,  $W \sim 0.1$  eV, а константа электрон-бозонного взаимодействия  $\lambda \sim 1$ , так как в силу локальности этого взаимодействия оно не может быть слабым. Легко оценить величину  $T_c$  на основе рассматриваемого механизма. Для  $W \sim 0.1$  eV  $T_c$  может превышать 100 К. Наряду со спариванием через возбуждения со щелью  $W$  в ВТСП свободные носители, конечно, могут спариваться и через фононы, включая и фононы подрешетки тяжелых дырок.

Из-за локальной природы бозонов и малой длины когерентности  $\xi$  возникает аномальная зависимость верхнего критического магнитного поля от температуры  $H_{c2}(T)$ . В этом случае, когда неприменимо приближение среднего поля и возрастает роль флюктуаций параметра порядка, зависимость  $H_{c2}(T)$  должна иметь положительную кривизну во всем интервале температур [23–25]. При этом результат не зависит от конкретной природы связи электронов в пары [26]. С ростом легирования в металлической фазе увеличивается экранирование свободными носителями. Это приводит к уменьшению щели  $W$ , размытию краев зон (рис. 3), понижению  $T_c$  и исчезновению аномалий свойств. В результате остается только обычная фоновая сверхпроводимость с низкой  $T_c$  и обычной зависимостью  $H_{c2}(T)$ , предсказываемой теорией БКШ.

С ростом анизотропии соединения уменьшается эффективное экранирование в решетке, увеличивается ее локальная поляризуемость и деформация. Это приводит к росту величины  $W$ . В общем предлагаемый механизм сводится к варианту «локального БКШ».

## 2. Экспериментальные исследования

Развитая выше модель была основана на широком классе экспериментальных исследований ВТСП-материалов, проведенных с нашим участием и включающих в себя оптические [27–29], гальваномагнитные [30], нейтронографические [31] измерения, исследования упругих свойств и теплового расширения [32–34], теплоемкости в слабых и сильных магнитных полях [35]. Кроме того, использовались данные других авторов.

На рис. 5 показаны примеры зависимостей  $H_{c2}(T)$  для образцов разных классов ВТСП [8, 35–40]. Эти измерения выполнены в магнитных полях вплоть до 35 Т. Видно, что для всех этих ВТСП до самых низких температур зависимость  $H_{c2}(T)$  аномальна, т.е. имеет положительную кривизну и принципиально отличается от зависимости, предсказываемой традиционной фоновой моделью сверхпроводимости. Данные для ВКВО получены, в частности, методами измерения скачка теплоемкости в полях до 20 Т [35] и магнитной восприимчивости [8]. Эти результаты хорошо согласуются с резистивными измерениями [30, 38, 39]. Необходимо отметить, что на рис. 5 приведены данные для образцов ВКВО высокого качества. Для менее качественных образцов с малым эффектом Мейснера кривые становятся менее аномальными и более

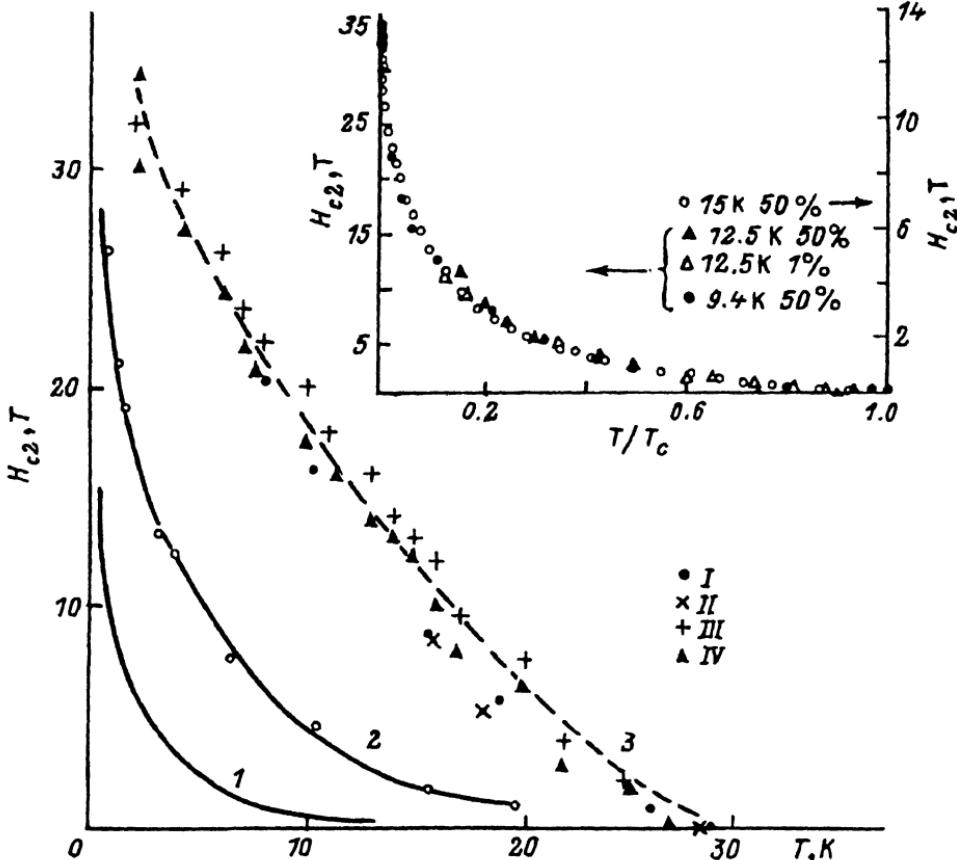


Рис. 5. Зависимости верхнего критического магнитного поля  $H_{c2}(T)$  от температуры для соединений.

1 —  $Tl_2Ba_2CuO_6$  [36], 2 —  $Bi_2Sr_2CuO_y$  [37]; 3 —  $Ba_{0.6}K_{0.4}BiO_3$ ; I — данные, полученные по измерениям теплоемкости [35]; II — данные, полученные по магнитной восприимчивости [8], III, IV — соответственно резистивные измерения из работ [38] и [39]. На вставке показаны результаты для  $YBa_2(Cu_{0.97}Zn_{0.03})_3O_{7-\delta}$  [40] (левая шкала) в сравнении с данными для  $Tl_2Ba_2CuO_{6+\delta}$  (правая шкала).

похожими на стандартные кривые модели БКШ. Аномальные зависимости  $H_{c2}(T)$  в широком интервале температур для образцов с большим эффектом Мейснера наблюдаются и для других ВТСП, например для  $HgBa_2CaCu_2O_{6+\delta}$  [41]. Полученные зависимости  $H_{c2}(T)$  однозначно доказывают предсказываемую локальную природу электронного спаривания в ВТСП при учете реально измеренных значений  $\lambda$ . Отметим, что в ВКВО при высоком уровне легирования ( $x \gtrsim 0.5$ ) зависимость  $H_{c2}(T)$  перестает быть аномальной и описывается в рамках модели БКШ [42]. Этот результат согласуется с выводами предлагаемой физической картины, обсуждавшейся выше.

Измерения упругих свойств и теплового расширения в таких соединениях, как ВКВО [33, 34],  $YBaCuO$  [32],  $LaSrCuO$  [43], показали, что при низких температурах при малых уровнях легирования нагревание кристалла сопровождается его сжатием. Максимальное сжатие в случае ВКВО [8] при нагреве наблюдается для образцов с малым  $x$ ,

причем интервал температур, в котором  $\alpha < 0$ , достигает для них 60 К. С ростом  $x$  величина (модуль) коэффициента теплового расширения уменьшается, и область температур, где  $\alpha < 0$ , сужается. Однако даже для образцов металлической фазы ( $x = 0.4$ ) с  $T_c \cong 30$  К коэффициент  $\alpha$  все еще отрицателен в некотором интервале температур (примерно 15 К). Образцы с более высоким уровнем легирования ( $x = 0.5$ ) и  $T_c = 15$  К обладают нормальным положительным коэффициентом теплового расширения во всем исследованном интервале температур. Как было показано выше, такое аномальное поведение  $\alpha$  является следствием локальной неустойчивости решетки, вытекающей из отрицательности диэлектрической проницаемости и связано с тепловым возбуждением фононов с  $Q \approx G/2$  на границе зоны Бриллюэна.

#### 4. Заключение

Таким образом, анализ проведенных нами экспериментальных исследований ВТСП с привлечением некоторых других данных позволил выяснить особенности их электронного упорядочения, механизма концентрационного перехода диэлектрик–металл, объяснить ряд их общих аномальных свойств, выяснить некоторые особенности механизма сверхпроводимости ВТСП. Показано, что локализованные тяжелые дырки играют в системах ВТСП двойственную роль. С одной стороны, они, как дополнительные атомы, приводят к перестройке и локальной неустойчивости решетки (ВЗП). С другой стороны, их возбуждения, как и фононы, приводят к сверхпроводящему спариванию свободных носителей. Предложенная модель описывает целый ряд физических свойств оксидных ВТСП и допускает дальнейшую экспериментальную проверку.

Работа поддерживается Научным советом по Программе ВТСП (проект № 93069), Международным научным фондом (грант № N9V000) и Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 95-02-06052-а).

#### Список литературы

- [1] A.S. Alexandrov, N.F. Mott. Rep. Prog. Phys. **57**, 1197 (1994).
- [2] В.Л. Гинзбург, Е.Г. Максимов. СФХТ **5**, 1543 (1992).
- [3] P.W. Anderson. Physica **C185–189**, 11 (1991).
- [4] N.F. Mott. J. Phys.: Cond. Matter. **5**, 3487 (1993).
- [5] Θ.Α. Пашицкий. ФНТ **19**, 2, 140 (1993).
- [6] J.E. Hirsch. Physica **C201**, 347 (1992).
- [7] N.V. Anshukova, A.I. Golovashkin, L.I. Ivanova, A.P. Rusakov. Prog. High- $T_c$  Supercond. **32**, 403 (1992).
- [8] Н.В. Аншукова, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, О.Т. Малючков, А.П. Русаков. ЖЭТФ **108**, 2132 (1995).
- [9] S. Pei, J.D. Jorgensen, B. Dabrowsky, D. Hinks, D. Richard, A. Mitchell, Phys. Rev. **B41**, 4126 (1990).
- [10] H. Sato, S. Tajima, H. Takagi, S. Uchida. Nature **338**, 241 (1989).
- [11] A.L. Shchelohov, N.V. Anshukova, A.I. Golovashkin, L.I. Ivanova, A.P. Rusakov. Physica **C185–189**, 989 (1991).
- [12] M. Verwerft, G. van Tendeloo, D.G. Hinks, B. Dabrowski, D. Richards, A. Mitchell, D. Matx, S. Pei, J. Jorgensen. Phys. Rev. **B44**, 9547 (1991).
- [13] Y.J. Uemura, B.J. Sternlieb, D.E. Cax, J. Brewer, R. Kadono, J. Kempton, R. Kieft, S. Kreitzman, G. Luke, P. Mulher, T. Riseman, D. Williams, W. Kossler, X. Yu, C. Stronach, A. Sleight. Nature **335**, 151 (1988).

- [14] M. Licheron, N. Lissart, F. Gervait. Solid State Commun. **79**, 667 (1991).
- [15] Z.X. Shen, P.A.P. Lindberg, B.O. Wells, D. Dessan, A. Borg, I. Lindau, W. Spicer, W. Ellis, G. Kwei, K. Ott. Phys. Rev. **B40**, 6912 (1989).
- [16] S.M. Heald, D. DcMarsio, M. Croft. Phys. Rev. **B40**, 8828 (1989); M.W. Ruckman, D. di Marrio, Y. Jeon, M. Hegde, S. Li, M. Greenblatt. Phys. Rev. **B39**, 7359 (1989).
- [17] A.P. Rusakov. Phys. Stat. Sol. (b) **72**, 503 (1975).
- [18] W.E. Pickett. Rev. Mod. Phys. **61**, 433 (1989).
- [19] S. Uchida. Physica **C185-189**, 28 (1991); J. Fink, N. Nucker, M. Alexander. Ibid. P. 45.
- [20] S.K. Sinha, D. Vakhin, M.S. Alvarez, A. Jacobson, J. Newsam, J. Lewandowski, J. Johnston, C. Stassis, J. Tranquada, T. Freltoft, H. Moudden, A. Goldman, P. Zollik. Physica **B156-157**, 854 (1989).
- [21] R.J. Cava, A.W. Hewat, E.A. Hewat. Physica **C165**, 419 (1990).
- [22] W.F. Huang, Z.J. Xu, S.H. Liu, M.K. Wu. Phys. Rev. **B41**, 2052 (1990).
- [23] R. Micnas, J. Ranninger, S. Robaszkiewicz. Rev. Mod. Phys. **62**, 113 (1990).
- [24] S. Ullach, A.T. Dorsey. Phys. Rev. **B44**, 262 (1991).
- [25] A.C. Александров, А.Б. Кребс. УФН **162**, 1 (1992).
- [26] J.R. Cooper, J.W. Loram, J.M. Wade. Phys. Rev. **B51**, 6179 (1995).
- [27] A.L. Shelekhov, A.I. Golovashkin, K.V. Kraiskaya. Physica **C185-189**, 1007 (1991).
- [28] A.L. Shelekhov, N.V. Anshukova, A.I. Golovashkin, L.I. Ivanova, A.P. Rusakov. Physica **C185-189**, 989 (1991).
- [29] А.И. Головашкин, К.В. Крайская, А.Л. Шелехов. ФТТ **32**, 1, 175 (1990).
- [30] Н.В. Аншукова, В.Б. Гинодман, А.И. Головашкин, Л.Н. Жерихина, Л.И. Иванова, А.П. Русаков, А.М. Чховребов. ЖЭТФ **95**, 1635 (1990).
- [31] М.Г. Землянов, П.П. Паршин, П.И. Солдатов, Н.В. Аншукова, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, А.П. Русаков. СФХТ **4**, 961 (1991).
- [32] Н.В. Аншукова, Г.П. Воробьев, А.И. Головашкин, О.М. Иваненко, К.В. Мицек. Письма в ЖЭТФ **46**, 373 (1987).
- [33] Н.В. Аншукова, Ю.В. Богуславский, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, И.Б. Крынечкий, А.П. Русаков. ФТТ **35**, 4, 1415 (1993).
- [34] N.V. Anshukova, A.I. Golovashkin, Yu.V. Boguslavskii, L.I. Ivanova, A.P. Rusakov, I.B. Krinetskii. J. Supercond. **7**, 427 (1994).
- [35] Г.Х. Панова, А.А. Шиков, Б.И. Савельев, А.П. Жернов, Н.В. Аншукова, А.И. Головашкин, Л.И. Иванова, А.П. Русаков. ЖЭТФ **103**, 605 (1993).
- [36] A.P. Mackenzie, S.R. Julian, G.G. Lonzazich, A. Carrington, S. Hughes, R. Liu, D. Sinclair. J. Supercond. **7**, 271 (1994).
- [37] M.S. Osofsky, R.J. Soulen, S.A. Wolf, J. Broto, H. Rakoto, J. Ousset, G. Coffe, S. Askenazy, P. Pari, I. Bozovic, J. Eckstein, G. Virshup. J. Supercond. **7**, 279 (1994).
- [38] C. Escribe-Filippini, J. Marcus, M. Affronte. Physica **C210**, 133 (1993).
- [39] M. Affronte, J. Marcus, C. Escribe-Filippini, A. Sulpice, H. Rakoto, J. Broto, J. Ousset, S. Askenazy. Phys. Rev. **B49**, 3502 (1994).
- [40] D.J. Walker, O. Laborde, A.P. Mackenzie. Phys. Rev. **B51**, 9375 (1995).
- [41] L. Krusin-Elbaum, C.C. Tsuei, A. Gupta. Nature **373**, 679 (1995).
- [42] М.Н. Хлопкин, Г.Х. Панова, А.В. Суэтин, Н.А. Черноплеков, А.А. Шиков. СФХТ **7**, 495 (1994).
- [43] T. Hanaguri, T. Fukase, T. Suzuki, I. Tanaka, H. Kojima. Physica **B194-196**, 1579 (1994).